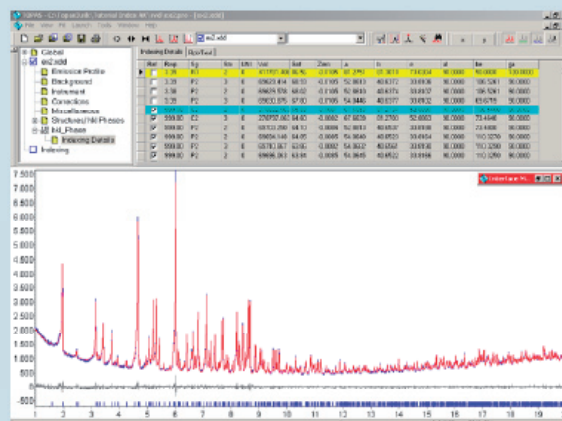
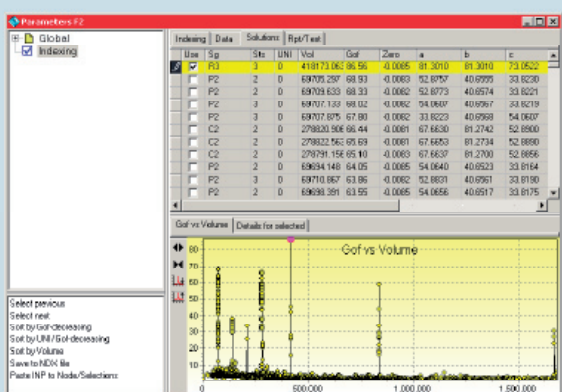


PROJEKT NR: POIG.02.02.00-00-012/08 „DOPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW”

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ - DOTACJE NA INNOWACJE

DIFFRACplus Professional TOPAS

Solving crystal structures with TOPAS
Indexing - LSI



- Goodness-of-fit (GoF) versus volume display
- Easy identification of fractional and multiple volumes

- Fully automatic Pawley or Le Bail fitting of all or user selected solutions

DIFFRACplus Professional TOPAS jest wykorzystywany w rentgenowskiej ilościowej - i jakościowej analizie fazowej.

Posiada następujące zalety:

- zastosowane metody dopasowania widma nie wymagają odniesienia do modelowej struktury krystalicznej;
- możliwe jest dopasowanie pojedynczej linii, dopasowanie całego dyfraktogramu, jak również rozkład widma metodą Pawley'a i LeBaila;
- pakiet posiada możliwość dokładnego określenia parametrów widma, stałych sieciowych jak i bezwzorcową analizę mikrostruktury.

Pozwala na:

- analizowanie równocześnie wielu dyfraktogramów uzyskanych za pomocą konwencjonalnego promieniowania rentgenowskiego, wiązki synchrotronowej bądź neutronowej;
- analizowanie wielu pików, danych punktowych i ich parametrów;
- ustalenie, znajdowanie lub zadanie w określonych granicach wszystkich analizowanych parametrów;
- dowolne liniowe- i nieliniowe ograniczenia analizy poprzez stosowne "równania";
- nie jest wymagane podanie parametrów startowych.

Jest wspomaganym graficznie pakietem oprogramowania służącym do nieliniowej analizy widma dyfrakcyjnego.

Kontakt:

Dr hab. inż. Jan Bonarski
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
tel.:tel: +48 12 295 28 71; fax: +48 12 295 28 04; nmbonars@imim-pan.krakow.pl